

REQUEST

04P00098

1/3

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄 国際出願番号	
0-1	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書 は、 右記によって作成された。	
0-4-1		JPO-PAS 0322
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	04P00098
I	発明の名称	半導体検査方法及びそのシステム
II	出願人 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。	出願人である (applicant only) 米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-1	名称	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
II-4en	Name:	SII NANOTECHNOLOGY INC.
II-5ja	あて名	2618507 日本国
II-5en	Address:	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 8, Nakase 1-chome, Mihamachi-ku, Chiba-shi Chiba 2618507 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	043-211-1150
II-9	ファクシミリ番号	043-211-8020
II-11	出願人登録番号	503460323

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	小川 貴志
III-1-4ja	氏名(姓名)	OGAWA, Takashi
III-1-4en	Name (LAST, First):	
III-1-5ja	あて名	2618507 日本国 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 エスアイアイ ・ナノテクノロジー株式会社内
III-1-5en	Address:	c/o SII NANOTECHNOLOGY INC., 8, Nakase 1-chome, Mihamachi, Chiba-shi Chiba 2618507 Japan
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-1-7	住所(国名)	日本国 JP
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく 出願人のために行動する。 氏名(姓名)	代理人 (agent) 松下 義治
IV-1-1en	Name (LAST, First):	MATSUSHITA, Yoshiharu
IV-1-2ja	あて名	1500012 日本国 東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 AIOS 広尾ビル807号
IV-1-2en	Address:	AIOS Hiroo Building 807, 11-2 Hiroo 1-chome, Shibuya-ku Tokyo 1500012 Japan
IV-1-3	電話番号	03-3440-8651
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-5475-5947
IV-1-6	代理人登録番号	100079212
V	国の指定	
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則 4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束さ れる全てのPCT締約国を指定し、取得しうる あらゆる種類の保護を求め、及び該当する 場合には広域と国内特許の両方を求める 国際出願となる。	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	出願日	2004年 02月 25日 (25.02.2004)
VI-1-2	出願番号	2004-050296
VI-1-3	国名	日本国 JP
VI-2	優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の番号のもの については、出願書類の認証謄本を作成 し国際事務局へ送付することを、受理官庁 に対して請求している。	VI-1
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	一	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日に おける出願人の資格に関する申立て	一	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日 における出願人の資格に関する申立て	一	
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国と する場合)	一	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例 外に関する申立て	一	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	3	✓
IX-2	明細書	9	✓
IX-3	請求の範囲	2	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	5	✓
IX-7	合計	20	
IX-8	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-17	手数料計算用紙	一	✓
IX-19	PCT-SAFE 電子出願	一	一
IX-20	要約書とともに提示する図の番号	1	
X-1	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/100079212/	
X-1-1	氏名(姓名)	松下 義治	
X-1-2	署名者の氏名		
X-1-3	権限		

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受 理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する 書類又は図面であってその後期間内に提 出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補 完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関 に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--